

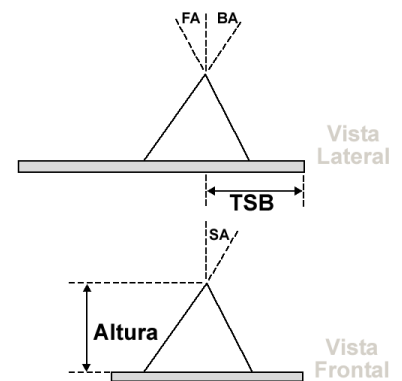
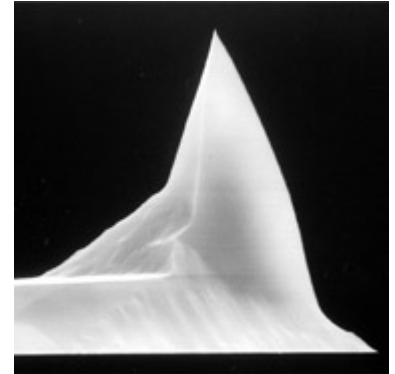
MESP:

Puntas devastadas de Silicio para Fuerza Magnética

Especificaciones de la Punta

Geometría:	Anisotrópico
Altura de la Punta:	10um - 15um
Ángulo Frontal:	25°
Ángulo Posterior:	15°
Ángulo Lateral:	22.5°
Radio de la Punta (Nom.):	<10nm
Radio de la Punta (max.):	15nm
Tip Set Back (Nom.):	15um
Tip Set Back (Rng.):	5um a 25um
Compensación de Inclinación de la Punta:	0°
Altura de pico (Nom.):	
Altura de pico (Rng.):	
Ancho del pico:	
Ancho del pico (Rng.):	
Proyección:	
Longitud efectivo de cuello:	


MICRA®
ingeniería y sistemas de precisión



Notas:

Coercitividad: ~400 Oe. (Medio)
Momento: 1e-13 emu (Medio)

La punta MESP es la punta estándar para Microscopía de Fuerza Magnética. Como el recubrimiento también es conductivo, la MESP es generalmente una opción excelente en costo para la microscopia eléctrica y de capacitancia.

Modelo #	Parte #	Montura	Notas	Cant./paq..
MESP	MESP	Sin montar		10
MESP7	MESP7	Sin montar		70
MESPW	MESPW	Sin montar		385
1670-00	1670-00	Explorer		8
MESP-CPMT	MESP-CPMT	CP		10

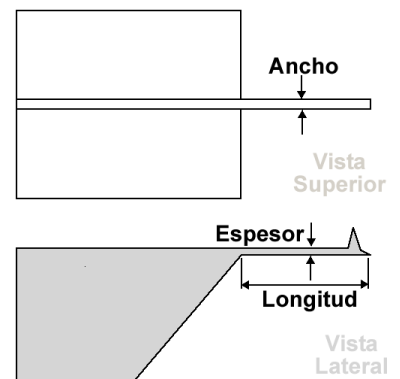
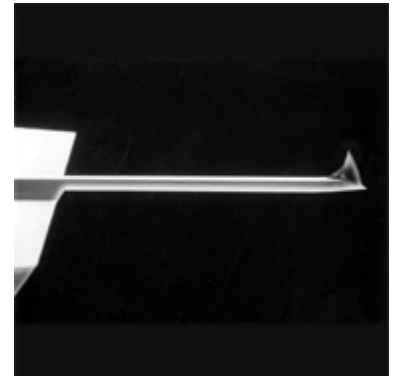
MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

MESP:

Puntas devastadas de Silicio para Fuerza Magnética

Especificaciones del Cantilever

Material:	Antimony (n) doped Si
Espesor Nominal:	3um
Espesor, Rango:	2.5um a 3.5um
Recubrimiento frontal	
Capa Inferior:	1 - 10nm de Cr
Capa Superior:	10 - 250nm de Co/Cr
Recubrimiento Posterior:	1 - 10nm de Cr



Notas:

Las composiciones y espesores específicos de los recubrimientos para Microscopía de Fuerza Magnética no se proporcionan debido a que son datos propiedad de Veeco. Los materiales y espesores que se mencionan se dan como lineamientos generales.

Forma	Longitud (um)			Ancho (um)			Frecuencia (kHz.)			k (N/m)		
	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.
A Rectangular	225	200	225	28	23	33	75	60	100	2.8	1	5

MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.